

## عنوان مقاله:

یک روش جدید جهت تست مدارهای مجتمع به وسیله چگالی طیفی امواج EM

## محل انتشار:

چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور (سال: 1390)

تعداد صفحات اصل مقاله: 2

## نویسندگان:

ارش احمدی - گروه برق دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی

سیدوهاب الدین مکی

فهیمة جعفری

## خلاصه مقاله:

تست مدارهای مجتمع با پوشش تست مناسب Test Coverage نیازمند تجهیزات پیشرفته ATE است که بسیار پرهزینه می باشد هزینه تست تراشه ها با توجه به توسعه سریع صنعت نیمه هادی و افزایش تعدادمولفه های تراشه ها هرساله افزایش می یابد و حتی در آینده ممکن است از قیمت ساخت تراشه بیشتر شود دراین مقاله یک روش جدید جهت تست مدارهای مجتمع و تشخیص تراشه های معیوب ارایه شده است این روش مبتنی بر تحلیل چگالی طیفی امواج EM منتشر شده از یک تراشه در حال تست و بررسی همبستگی آن با طیف تابشی دیگر تراشه ها می باشد.

## کلمات کلیدی:

آزمون پذیری، امواج EM، چگالی طیفی

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/121695>

